

Tektronix 抖動量測 2.0 版解決方案

一個可快速、準確解決複雜抖動問題的完整解決方案

正當您沒有足夠時間追蹤問題所在，低抖動系統效能加上弄不清楚疑難排解讓您雪上加霜。處理抖動現在是任何高速設計和許多串列資料標準的強制性一部分，因此需要進行大量的抖動相容性測試。

抖動特性分析包含複雜的訊號分析，量測需求範圍從簡單到複雜、發送器之間的互通性，以及完整串列資料連結分析所需的通道結果。不管您的特定需求是什麼，Tektronix 都有辦法能夠快速有效地解決您設計上的挑戰。

創新的量測解決方案，例如數位化示波器、邏輯分析儀、即時頻譜分析儀、時域反射儀、訊號產生器、高傳真探棒和分析軟體的出現，協助您解決抖動的問題。

找出並修正抖動源

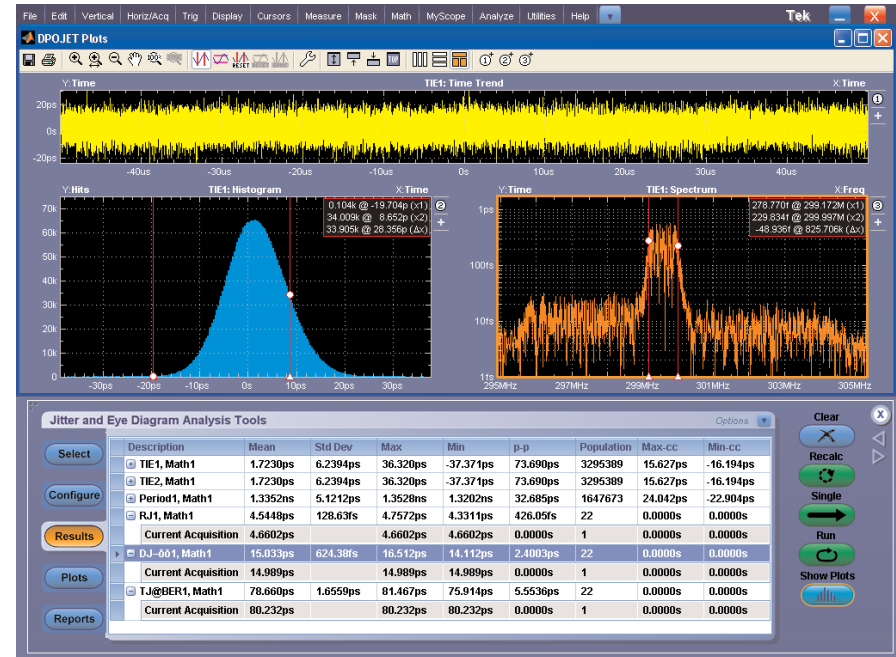
- 找出：
 - 週期性的抖動效應
 - 諧波抖動關係
- 檢視抖動結果：
 - 相位雜訊
 - 眼狀圖
- 利用準確的旋積 (convolution) 模型或業界特定的 dual-dirac 模型來確定抖動分解。

獲得標準的特定相容性

- 標準特定抖動和眼狀圖
- 邊際量測和極限測試
- 通過/失敗量測和即時遮罩測試

針對完整連結，找出並修正影響抖動和雜訊的成因

- 瞭解通道效應
- 瞭解接收器上的等化效應
- 預測接收器上的 BER 輪廓圖
- 完整通道模擬，包括在接收器的比較器所觀察到的實際眼狀圖等化情形



Tektronix 抖動量測 2.0 版解決方案

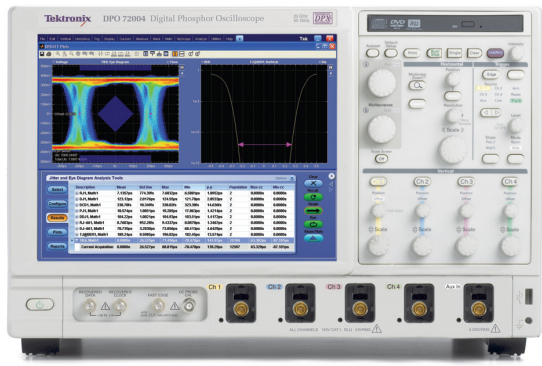
一個可快速、準確解決複雜抖動問題的完整解決方案



抖動與時序分析 (適用於除錯和設計驗證)

DPO/DSA 即時示波器與 DPOJET 抖動應用軟體 & 探棒

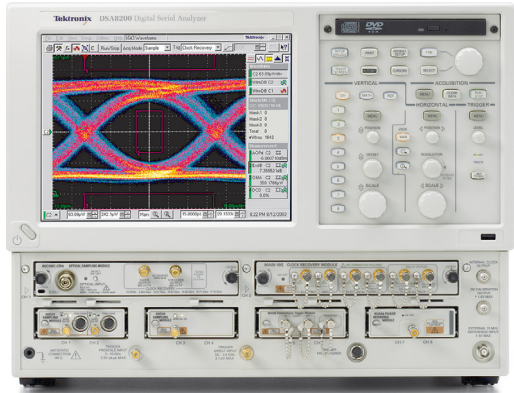
- 涵蓋所有業界最大即時頻寬標準
- 利用全取樣率和記錄長度，在所有 4 個通道精確找出時序異常訊號
- 利用高達 300,000 wfms/s 的 DPX[®] 取樣技術快速找出間歇性事件
- 利用 DPOJET 分析軟體的決定性抖動 (週期性、時脈和資料相依) 功能，分解抖動和隔離隨機抖動組成部分。
- 業界唯一的分析工具，包括頻譜平均和峰值檢測，以找出低或然率和低位準抖動。
- 不需連接待測裝置，即可擷取、共用波形並待日後分析，可節省時間。



抖動和眼狀圖分析 (適用於相容性測試)

DPO/DSA 即時示波器與 DPOJET 抖動應用軟體 & 探棒

- 相容性測試軟體含最新的串列資料標準
- 業界最準確且接受度最高的即時 TJ@BER 結果
- 示波器與量測軟體，可執行完整實體層相容性測試
- 業界唯一的解決方案，可執行差動時脈以擷取並量測「雙通道」資料 (不需探棒)
- 利用單一擷取捕獲 PCIe 所需的 100 萬個單位的時間間隔
- 業界唯一的即時 One Touch 抖動精靈和內建專業知識指南



適用於完整的串列資料連結 (SDLA) 的抖動和雜訊分析

具 80SJNB 先進軟體與探測功能的 DSA 取樣示波器

- 使用 IConnect[®] 軟體的整合式 TDR 與 S 參數量測，減少測試夾具訊號衰減造成的量測錯誤。
- 準確分析預測串音和抖動訊號路徑，以確保可靠性與串列資料網路分析 (SDNA)
- 利用抖動、雜訊和 BER 分析確定眼狀圖閉合的真正原因，以及使用串列資料連結分析 (SDLA) 快速評估各種 FFE/DFE 等化設定，以達成接收器上最大的眼狀圖開口。

www.tektronix.com/jitter

Copyright © 2008, Tektronix. 版權所有。Tektronix 產品受美國和外國專利權的保護、聲明與審查。
本出版品中的資訊可取代之前任何出版品中的資訊。本公司保留變更規格與價格的權利。TEKTRONIX 和 TEK 為 Tektronix, Inc. 的註冊商標。
文中所提到的其他服務標誌、商標或註冊商標分別屬於該公司所有。 8/08 FLG/WOW 55T-17692-3